

证书号第 3194262 号



发明专利证书

发明名称：一种阵列天线近场幅相测量方法及幅相测量器

发明人：林玉洁;王长红;王帅;代计博;高原;安建平;卜祥元
肖冀秋

专利号：ZL 2015 1 1030715.2

专利申请日：2015 年 12 月 31 日

专利权人：北京理工大学

地址：100081 北京市海淀区中关村南大街 5 号北京理工大学

授权公告日：2018 年 12 月 25 日

授权公告号：CN 105572487 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号第 3194262 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 31 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京理工大学

发明人：

林玉洁；王帅；代计博；高原；安建平；卜祥元；肖冀秋